

ART-25 光学素子測定装置



本装置は、波長350～1100nmの波長間で、レンズ、板硝子、フィルタ、反射鏡、プリズム等の光学素子の分光透過率及び反射率測定を行う装置です。反射率測定時の試料の入射角度は任意角度可変で、反射率測定時の最小入射角度15°（光軸角30°）まで設定可能です。偏光測定機構を実装し、弊社独自のミラー光学系により、P偏光・S偏光の測定の他に、45° N偏光の直接測定が可能です。

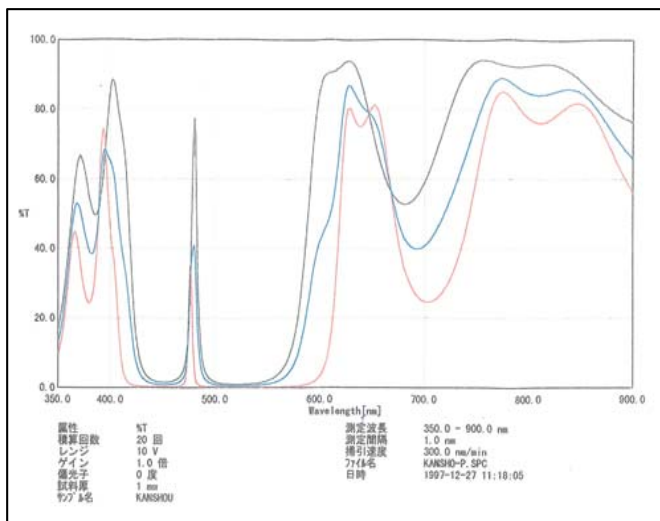
- レンズ、板硝子、フィルタ、反射鏡、プリズムの分光測定
- オプションで波長220～2000nmに対応
- 45° N偏光の実測偏光測定が可能
- 特注で、ペンタプリズム、ペンタミラー、デジタルカメラ用超望遠交換レンズ、放送用大型ビデオカメラレンズ、ステッパの大型レンズ、大型ガラスの試料に対応実績有

型 式	ART-25 光学素子測定装置
測定項目	分光透過率及び反射率
測定範囲	350~1100nm (オプションで220~2000nm対応可)
測定方式	バックグラウンド測定方式 試料の無い状態でバックグラウンドデータを測定し、次に試料をセットした状態で測定し、バックグラウンドデータとの割り算にて透過率あるいは反射率を算出
補正方式	ダブルビーム2系統補正方式 リファレンス側・試料側の光学系によって変動をキャンセルし高精度測定を行う
波長純度	約2nm* ₁
波長正確さ	±0.1nm以内
測定精度	±0.2%以内* ₂
最小入射角	15° (光軸角30°)
照射光サイズ	5×5mm以下
偏光角	0・45・90° (ソフトウェアにて設定可能)

*1 分光器スリット幅0.7mmの場合
*2 偏光子無 (100%における)

● 測定データ

干渉フィルタをそれぞれ偏光0° P・偏光45° N・偏光90° S、3つを比較した透過率測定データ



偏光0° P・偏光45° N・偏光90° Sでの3データが重なり合う波長では、必ず3データが1点で重なり合っています。

■ 標準構成内容

1. ハロゲンランプ 150W
2. 光源集光部
3. 分光器 (M25-T 1200本/500nmブレード)
4. ダブルビーム光学部
5. 偏光子(UVグラン・トムソン偏光プリズム)
6. 偏光解消板 (光学用人工水晶)
7. 試料室
8. 試料台
9. 光軸モニタ用レーザ
10. 積分球
11. 検知器 (光電子増倍管およびSiフォトダイオード)
12. 全体架台
13. インターフェースユニット
14. コンピュータシステム
15. 校正用JQAフィルタ

■ ユーティリティ

外形寸法：W2100×D900×H1750mm *突起部含まず
電気容量：AC100V ±10V 50/60Hz 10A

- 寸法はおおよその大きさです。オプション等により外観および寸法が異なる場合があります。
- 記載の仕様および外観は予告なしに変更する場合があります



分光計器株式会社

[http:// www.bunkoukeiki.co.jp/](http://www.bunkoukeiki.co.jp/)

本社・工場 TEL 042-646-4123 〒192-0033 東京都八王子市高倉町4-8
東日本営業所 TEL 03-3837-1021 〒113-0034 東京都文京区湯島3-23-1 (天神弥栄興産ビル4階)
西日本営業所 TEL 06-6323-4502 〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新3-24-5 (クリスタルビル2階)